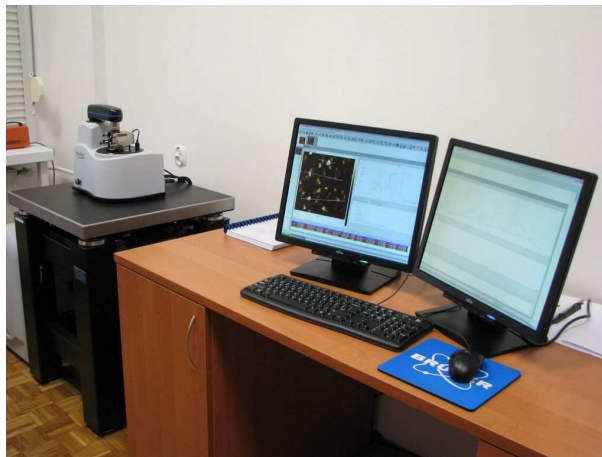


Mikroskop sił atomowych Innova (Bruker)



- obrazowanie powierzchni:

- pomiary wykonywane w powietrzu,
- tryby pracy: Tapping Mode, Contact Mode,
- obszar skanowania: 0.1 μm -90 μm ,
- oprogramowanie: NanoScope Analysis, MountainMap Premium 6.2,
- obrazy 2D i 3D,

- pomiary:

- odległość, wysokość, promień krzywizny, średnica, pole powierzchni, objętości,...
- parametry chropowatości:
 - * R_p , R_z , R_t , R_q , R_{ku} , R_v , R_c , R_a , R_{sk} , R_m (PN-EN ISO 4287)
 - * S_q , S_{ku} , S_v , S_a , S_{pk} , S_{sk} , S_p , S_z , S_k , S_{vk} , $SMr1$, $SMr2$, S_{xp} , V_{vv} , V_{vc} , V_{mp} , V_{mc} , Sal , Str (PN-EN ISO 25178)
- profile liniowe,
- analiza/zliczanie obiektów na powierzchni,

